

三段階 샘플링 檢査方式

Three-stage Sampling Inspection Plans

柳 文 燦*
裴 道 善*

Abstract

A system of conditional sampling plans composed of three stages is developed. In the first stage, the decision to accept or reject the lot is based on the information obtained from the current lot. When a decision is not made in the first stage, a second stage is introduced and the information from the immediately preceding lot as well as the information from the current lot is used for the decision. When a decision is not made in the first stage, a second stage is introduced and the information from the immediately preceding lot as well as the information from the current lot is used for the decision. When a decision is not made in the second stage either, the decision is deferred until the information from the immediately following lot is obtained. Existing tables for constructing double sampling plans with $n_2=2n_1$ can be used to find the parameters of these plans.

These sampling plans can bring sizable savings in the amount of inspection when the process is relatively stable. The response delay to the change in process quality and the deferred events may be considered as shortcomings of these plans. However, these are not serious in practical applications, and the reduction in sample size may more than offset these shortcomings.

I. 序 論

대부분의 룯트별 샘플링 검사방식은 當該 룯트에서 얻는 검사결과로써 룯트의 합격·불합격 판정을 하게 된다. 샘플링 검사를 행할 때 試料의 크기는 檢査費用과 직결되는 수가 많다. 특히 파괴해 보아야만 검사결과를 알 수 있는 破壞檢査(destructive testing)나 檢査費가 많이 드는 검사(costly testing)인 경우에는 시료의 크기가 커지면 검사비용의 부담이 커져 바람직하

지 못하게 된다.

生産者나 消費者 양측에 대해 만족스러운 品質水準에서 시료의 크기를 줄일 수 있는 방안이 다각도로 연구되어온 바, 이 중 當該 룯트의 검사결과 외에 他 룯트의 검사결과를 이용함으로써 시료의 크기를 줄일 수 있는 이른바 “條件附 샘플링 檢査方式(Conditional Sampling Inspection Plans)”이 Anscombe, Godwin 및 Plackett[1]의 연구이래 계속 개발되어 왔다.

Dodge[4]의 Chain Sampling Inspection Plans (ChSP-1)는 條件附 샘플링 檢査方式의 대표적 인 한 방식이며 ChSP-1의 變型으로서 ChSP-4,

* 韓國科學院

ChSP-4 A 가 있다[8]. 이들 방식은 試料의 크기를 줄이는 때는 효과적이나 判別能力이 낮아도 되는 (less discriminating) 경우이나 사용할 수가 있어 적용범위가 제한되어 있다. 이를 다소 보완한 것이 ChSP- c_1, c_2 [5] 및 ChSP(n_1, n_2)- c_1, c_2 [13] 검사방식이지만 이 방식들은 母數(parameters)의 수가 많기 때문에 生産者 및 消費者危險이 주어졌을 때 이를 만족시키는 母數들을 쉽게 구할 수 있는 방법이 아직 제시되지 않고 있고 適用節次도 복잡하여 實用性이 결여되어 있다.

Dependent Sampling Plans[17]나 Deferred State Sampling Plans[10, 15, 16]도 條件附 샘플링 檢査方式의 範疇에 속하는 것으로서 이들 두 방식도 역시 ChSP 검사방식이 갖고 있는 취약점을 해결하지 못하고 있고, Deferred State Sampling Plans는 判定保留狀態의 ロット들을 위한 空間의 확보문제도 아울러 갖고 있다.

Baker 와 Brobst[2]는 檢査節次를 대폭 간소화시키고 아울러 既存 샘플링 檢査計劃表로써 용이하게 검사방식의 母數를 구할 수 있는 Conditional Double Sampling Plans 를 개발하였다. 本 研究에서는 Conditional Double Sampling Plans 처럼 實用性이 높고 이보다 試料의 크기를 절감시킬 수 있는 “三段階 샘플링 檢査方式 (Three-stage Sampling Inspection Plans)”을 개발하고 이 方式을 既存 샘플링 檢査方式과 比較·評價한다.

三段階 샘플링 檢査方式을 適用할 수 있는 條件, 혹은 이 方式을 이론적으로 전개하기 위한 假定은 다음과 같다.

가) 각 ロット는 제품이 生産되는 順序대로 構成되어져야 한다.

나) 工程의 品質水準이 一定하다고 기대할 수 있어야 한다.

다) 試料의 크기는 ロット마다 一定하다.

II. 三段階 샘플링 檢査方式

二回 샘플링 검사에서는 一次 試料를 검사하여 不良品數가 一次 合格判定個數인 c_1 이하이면 ロット를 합격시키고 二次 合格判定個數인 c_2 보다

크면 불합격시킨다. 그리고 不良品數가 c_1 보다 크고 c_2 이하이면 二次 試料를 채취·검사하여 1차시료와 2차시료의 不良品數의 總으로써 합격 불합격의 判定을 한다.

이와 같이 2회 샘플링 검사에서는 2차시료를 當該 ロット에서 取하게 되는 바, 이는 多回 샘플링 검사나 逐次 샘플링 검사에서도 마찬가지이다.

三段階 샘플링 檢査方式은 當該 ロット의 試料로써 判定을 하지 못하면 直前·直後의 ロット의 검사결과를 이용하여 判定을 하는 방식이다. 이는 2차시료를 當該 ロット에서 뽑지 않는 것을 除外하면 2회 샘플링 검사방식과 判定방법이 유사하다.

三段階 샘플링 檢査方式의 適用節次는 다음과 같다.

① i 번째 ロット로부터 n 개의 試料를 채취·검사하여 良好品 혹은 不良品으로 구분한다. (i 번째 ロット의 試料중의 不良品數를 d_i 라 하기로 한다.)

$d_i \leq c_1$ 이면 i 번째 ロット를 합격시키며 $d_i > c_2$ 이면 불합격시킨다.

② $c_1 < d_i \leq c_2$ 이면 $i-1$ 번째 ロット의 검사결과를 이용하게 된다. 즉 $d_{i-1} + d_i > c_2$ 이면 i 번째 ロット를 불합격시키고, $d_{i-1} + d_i \leq c_2$ 이면 i 번째 ロット의 判定은 保留하고 $i+1$ 번째 ロット의 檢査를 行한다.

③ 保留된 ロット에 대해서는 다음과 같이 判定한다. 즉 $d_{i-1} + d_i + d_{i+1} \leq c_2$ 이면 i 번째 ロット를 합격시키고, $d_{i-1} + d_i + d_{i+1} > c_2$ 이면 불합격시킨다.

이와 같이 三段階 샘플링 檢査方式의 適用節次는 d_i 로써 判定을 하는 第一段階, $d_{i-1} + d_i$ 로써 判定을 하는 第二段階, 判定保留後 $d_{i-1} + d_i + d_{i+1}$ 로써 判定을 하게 되는 第三段階의 三段階로써 구성된다. 그림 1은 적용절차를 흐름도 (Flow Chart)로 나타낸 것이다.

三段階 샘플링 檢査方式에서는 合格判定個數가 c_1, c_2 두개 뿐이어서 第一段階에서 判定을 하지 못하여 第二段階로 가면 第二段階에서는 不合格判定만이 가능하며 따라서 合格判定은 第一段階와 第三段階에서만 가능하다.

위의 적용절차에 의해 ロット의 合格確率 $L(p)$

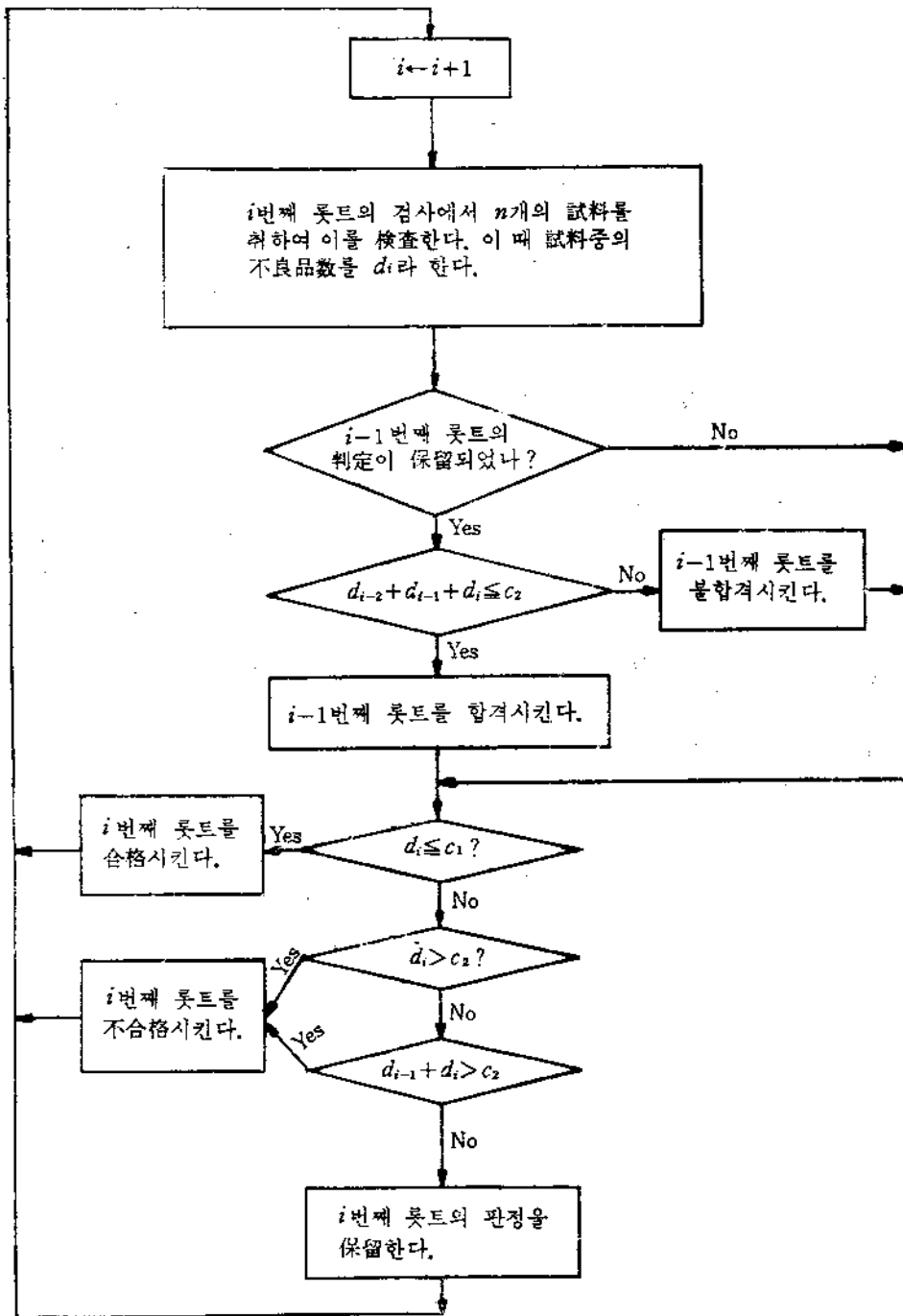


그림 1. 三段階 샘플링 檢査方式의 適用節次의 흐름도

는 다음과 같이 된다.

$$L(p) = \sum_{r=0}^{c_1} P_{n,r} + \sum_{r=c_1+1}^{c_2} P_{n,r} \sum_{s=0}^{c_2-r} P_{n,s} \sum_{t=0}^{c_2-r-s} P_{n,t} \quad (1)$$

단 여기서 $P_{n,i}$ 는 n 개의 試料중 i 개의 不良品

이 나올 확률이다. (1)식을 변형하면 다음과 같다.

$$L(p) = \sum_{r=0}^{c_1} P_{n,r} + \sum_{r=c_1+1}^{c_2} P_{n,r} \sum_{s=0}^{c_2-r} \sum_{t=0}^{c_2-r-s} \binom{n}{s} \binom{n}{t} p^{s+t}$$

$$\begin{aligned} & \cdot (1-p)^{2n-1-r} \\ & = \sum_{r=0}^{c_1} P_{n:r} + \sum_{r=c_1+1}^{c_2} P_{n:r} \sum_{v=0}^{c_2-r} \sum_{u=0}^v \binom{n}{u} \binom{n}{v-u} \cdot \\ & \quad p^v (1-p)^{2n-v} \\ & = \sum_{r=0}^{c_1} P_{n:r} + \sum_{r=c_1+1}^{c_2} P_{n:r} \sum_{v=0}^{c_2-r} \binom{2n}{v} p^v (1-p)^{2n-v} \\ & = \sum_{r=0}^{c_1} P_{n:r} + \sum_{r=c_1+1}^{c_2} P_{n:r} \sum_{v=0}^{c_2-r} P_{2n:v} \dots (2) \end{aligned}$$

(2)식은 $n_2=2n_1$ 인 2회 샘플링검사의 OC 函數와 一致한다. 즉 工程品質이 一定하다는 假定 下에서, 三段階 샘플링 檢査方式의 OC 曲線은 이에 대응하는 $n_2=2n_1$ 인 2회 샘플링 檢査방

식의 OC 曲線과 일치하는 바, 이는 3단계 샘플링 檢査方式의 母數를 구하는 데 $n_2=2n_1$ 인 2회 샘플링 檢査방식의 設計表를 이용할 수 있는 근거를 제공하는 것이다.

表 1은 $n_2=2n_1$ 인 2회 샘플링 檢査방식의 設計表이다. 이를 이용하여 주어진 p_1, p_2, α, β 에 대응하는 n, c_1, c_2 를 구할 수 있다.

一례로써, $p_1=0.01, p_2=0.08, \alpha=0.05, \beta=0.10$ 인 경우 $R=0.08/0.01=8$ 이므로 表 1을 보면 R 값이 8.0에 가장 가까운 檢査方式은 2

表 1. 二回 샘플링 檢査方式의 設計表¹⁾

($n_2=2n_1, \alpha=0.05, \beta=0.10$)

檢査方式 番 號	$R^{2)}$	合格判定個數		p, n_1 의 概算值			$P_a=0.95$ 가 되는 點에서의 (ASN) / n_1 의 概算值 ³⁾
		c_1	c_2	$P_c=0.95$	0.50	0.10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	14.50	0	1	0.16	0.84	2.32	1.273
2	8.07	0	2	0.30	1.07	2.42	1.511
3	6.48	1	3	0.60	1.80	3.89	1.238
4	5.39	0	3	0.49	1.35	2.64	1.771
5	5.09	1	4	0.77	1.97	3.92	1.359
6	4.31	0	4	0.68	1.64	2.93	1.985
7	4.19	1	5	0.96	2.18	4.02	1.498
8	3.60	1	6	1.16	2.44	4.17	1.646
9	3.26	2	8	1.68	3.28	5.47	1.476
10	2.96	3	10	2.27	4.13	6.72	1.388
11	2.77	3	11	2.46	4.36	6.82	1.468
12	2.62	4	13	3.07	5.21	8.05	1.394
13	2.46	4	14	3.29	5.40	8.11	1.472
14	2.21	3	15	3.41	5.40	7.55	1.888
15	1.97	4	20	4.75	7.02	9.35	2.029
16	1.74	6	30	7.45	10.31	12.96	2.230

번 檢査방식으로서 $c_1=0, c_2=2$ 가 되며, ($p_1, 1-\alpha$)점을 기준으로 하면

$$n = (pn_1)_{0.95} / p_1 = 0.30 / 0.01 = 30$$

이 되어 $n=30, c_1=0, c_2=2$ 이다.

III. 平均試料數 (ASN)

샘플링 檢査방식의 平均적도로써 가장 일반적 인 것이 OC 曲線이다. OC 曲線이 동일한 경우라

면 ASN (Average Sample Number)이 評價를 위한 重要한 尺度가 될 것이다.

表 2는 비슷한 OC 曲線을 갖는 檢査방식간의 ASN을 보여 주고 있다. 3단계 샘플링 檢査방식의 試料의 크기는 1회 및 2회 샘플링 檢査방식의 그것에 비해 상당히 작으며 그밖의 다른 檢査방식보다도 대체로 작은 값을 갖는다는 것을 表 2로 부터 알 수 있다.

三段階 샘플링 檢査方式은 $n_2=2n_1$ 인 2회 샘플링 檢査방식과 OC 曲線이 동일하다. 2회 샘플링 檢査에서는 1차 시료로써 判定을 하지 못하면 2차 시료를 취하게 되지만 3단계 샘플링 檢

1) Duncan[6], p. 188.

2) $R=p_2/p_1$

3) ASN은 短縮檢査를 하지 않는 것을 기준으로 한 것임.

表 2. ASN의 比較⁴⁾

種 類 ($p_1, p_2; \alpha, \beta$) 母數 및 ASN	A		B	
	(0.007, 0.10; 0.05, 0.10)		(0.01, 0.08; 0.05, 0.10)	
	母 數	ASN(p_1) ⁵⁾	母 數	ASN(p_1)
一回 샘플링 檢査	$c=1$	51	$c=2$	67
二回 샘플링 檢査	$n_2=n_1$ 인 경우	$c_1=0, c_2=1$	$c_1=1, c_2=2$	54
	$n_2=2n_1$ 인 경우	$c_1=0, c_2=1$	$c_1=0, c_2=2$	45
逐次 샘플링 檢査	—	24	—	38
ChSP-1 檢査	$i=3$	23	—	—
條件附 二回 샘플링 檢査 ⁶⁾	$a_1=0, a_2=1$ $r_1=r_2=2$	30	$a_1=1, a_2=2$ $r_1=r_2=3$	50
三段階 샘플링 檢査	$c_1=0, c_2=1$	23	$c_1=0, c_2=2$	30

사에서는 2차시료를 취할 필요가 없기 때문에 2회 샘플링 검사에 비해 ASN이 항상 작다. 表 2의 A, B 두 예에서와 같이 3단계 샘플링 검사 방식이 逐次 샘플링 檢査方式보다 ASN이 더 작을 수 있는 것은, 逐次 샘플링 檢査方式과는 달리 3단계 샘플링 검사방식에서는 當該롯트 외의 他롯트의 情報를 이용하기 때문이다. ChSP-1 검사방식과 같은 條件附 샘플링 檢査方式에서는 當該롯트의 判定을 위한 他롯트의 검사결과에 이용정도에 따라 試料의 크기가 달라질 것이다. B例에서 ChSP-1이 비교대상에 포함되어 있지 않은 것은 $\alpha=0.05, \beta=0.10$ 인 경우에는 OR (Operating Ratio; $=p_2/p_1$) 값이 10보다 작은 값에서는 이에 합당한 ChSP-1의 母數를 구할 수 없기 때문이다[12]. 따라서 ChSP-1은 p_1 과 p_2 의 값의 차이가 많이 나는 경우, 換言하면 判別能力이 작아도 될 때나 사용할 수 있는 검사 방식이라고 할 수 있겠다. 條件附 二回 샘플링 檢査方式은 $n_2=n_1$ 인 2회 샘플링 검사계획표를 이용하여 母數를 구한다. 그런데 일반적으로 n_2

$=2n_1$ 인 2회 샘플링검사가 $n_2=n_1$ 인 2회 샘플링검사보다도 n_1 값은 작으므로[9] 조건부 2회 샘플링 검사방식에 비해 3단계 샘플링 검사 방식이 試料의 크기面에서 效率的이다.

또한 샘플링은一回에 限하기 때문에 검사시간에 있어서도 多回 샘플링검사 및 逐次 샘플링 검사에 비해 다소 유리할 것이다.

IV. 反應 特性

三段階 샘플링 檢査方式에서는 當該롯트의 관점에 他롯트의 검사결과를 이용함으로써 試料의 크기를 줄일 수 있게 되나, 이에 대한 相殺效果로서 工程品質의 변화가 발생했을 때 이 변화를 感知하는 데 遲延이 있게 된다. 1회 샘플링 검사나 2회 샘플링검사와 같은 非條件附 샘플링 檢査方式에서는 品質의 변화가 발생하는 경우에 이 변화에 대한 反應度를 OC曲線만으로 把握할 수 있다. 그러나 條件附 샘플링검사에서는 OC曲線만으로는 工程品質의 변화에 대한 反應度가 當該롯트 외의 判定에 이용하는 롯트의 수 및 檢査方式의 母數값에 따라 달라지는 바, 이를 ARL(Average Run Length)을 이용하여 他檢査方式과 비교·평가한다.

工程品質의 變化에 있어서 실제로 문제가 되는 것은 不良率이 증가할 때의 反應度이므로 本研究에서는 p^0 의 不良率로 일정하게 유지되어 오다가 어느 순간에 p^1 보다 나쁜 품질인 $p^1(p^0 < p^1)$

4) 各 검사방식의 母數는 다음과 같은 文獻을 參考하여 구하였다. Cameron[3]; Duncan[6], pp. 188-189; Wald[14], pp. 51-53; Soundararajan [12].

5) 二回 샘플링 檢査方式과 逐次 샘플링 檢査方式의 ASN은 不良率이 p_1 일 때이며, 그의 方式에서는 不良率에 關係없이 一定하다.

6) 條件附 二回 샘플링 檢査方式에는 Dependent double sampling과 Deferred double sampling의 두 方式이 있으며, a_1, a_2 는 一次 및 二次 合格判定個數이며 r_1, r_2 는 一次 및 二次 不合格判定個數이다.

의 不良率로 변하여 이 水準으로 계속 유지되어 갈 때의 反應度에 대해서 考察한다.

Page[11]나 Ewan과 Kemp[7]는 거의 유사한 개념으로 ARL을 定義하고, "있는 바," 本研究에서는 ARL을, 品質의 變化가 발생하였을 때 變化가 발생한 때 부터 맨 처음 不合格된 ロット가 나타날 때 까지 檢査한 ロット수의 期待値로써 定義한다.

샘플링 檢査과정에서 일어날 수 있는 事象을 ロット의 合格과 不合格으로 二分할 수 있다. i 번째 ロット의 合格 및 不合格事象을 각각 A_i, R_i 라 하면 ARL은

$$ARL = \sum_{i=1}^{\infty} i P_r\{A_0, \dots, A_{i-1}, R_i\}$$

이 된다. 단 여기서 $P_r\{A_0\} = 1$ 로 定義한다. 그런데

$$P_r\{A_0, \dots, A_{i-1}, R_i\} = P_r\{A_0, \dots, A_{i-1}\} - P_r\{A_0, \dots, A_{i-1}, A_i\}, \quad i=1, 2, \dots$$

이므로

$$ARL = \sum_{i=1}^{\infty} i [P_r\{A_0, \dots, A_{i-1}\} - P_r\{A_0, \dots, A_i\}]$$

가 되어 이를 전개하여 정리하면

$$ARL = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} P_r\{A_1, \dots, A_i\} \dots \dots \dots (3)$$

여기서 $A_i, i=1, 2, \dots$ 가 모두 獨立事象이며 $P_r\{A_i\} = P_r\{A_1\}, i=1, 2, \dots$ 이면

$$P_r\{A_1, \dots, A_i\} = [P_r\{A_1\}]^i$$

이 되어 ARL은 幾何級數의 형태가 되므로 $P_r\{A_1\} = P_0$ 라고 두면 (3)식은 다음과 같이 표시된다.

$$ARL = \frac{1}{1-P_0} \dots \dots \dots (4)$$

즉 當該 ロット의 檢査결과만 이용하는 非條件附 샘플링 檢査方式에서는 ARL은 (4)식과 같이 ロット가 不合格될 確率의 逆數로 표시된다. 따라서 이런 경우는 어떤 불량률에 대한 ロット의 合格確率 P_0 (즉 OC 曲線)를 알 수 있다면 (4)식에 의해 바로 ARL을 구할 수가 있다.

(3)식은 어떠한 샘플링 檢査방식이나 적용될 수 있는 一般式이다. 그런데 ARL을 구하기 위해서는 먼저 結合確率(joint probability) $P_r\{A_1, \dots, A_i\}$ 를 알아야 한다. $P_r\{A_1, \dots, A_i\}$ 를 구하기 위하여 우선 벡터 π 와 行列 A 를 다음과 같이

定義한다.

π : 品質의 變化가 발생한 후 첫번째 ロット의, 檢査할 때의 狀態確率벡터(state probability vector). 不合格狀態를 除外한 각 狀態別로 그 狀態에 있을 확률이 π 벡터의 元素이다.

A : 不完全 轉移行列(incomplete transition matrix). 不合格狀態가 除外되었기 때문에 $A = \{a_{ij}\}$ 라 할 때 $\sum_j a_{ij} < 1$ 인 行(row)이 반드시 하나 이상은 있기 때문에 "不完全"이란 말을 사용하였다.

狀態의 數가 m 이라고 하면 π 는 $1 \times m$, A 는 $m \times m$ 이다. π 의 각 元素는 品質變化以後 첫번째 ロット가 합격될 확률이다. A 는 不合格狀態가 除外된 行列이므로, πA 는 品質의 變化가 발생한 후부터 두번째 ロット까지 합격될 확률로 구성된 벡터이며, $\pi A^{i-1}, i=1, 2, \dots$ 는 i 번째 ロット까지 連續 합격될 확률로 구성된 벡터이다. 따라서 $\pi A^{i-1} \mathbf{1}^T, i=1, 2, \dots$ 는 品質變化 이후 첫번째 ロット에서 i 번째 ロット까지의 모든 ロット가 합격될 확률을 나타낸다. 그러므로 結合確率 $P_r\{A_1, \dots, A_i\}$ 는

$$P_r\{A_1, \dots, A_i\} = \pi A^{i-1} \mathbf{1}^T$$

가 되어 이를 (3)식에 代入하면 ARL은 다음과 같이 표시된다.

$$ARL = 1 + \pi \sum_{i=1}^{\infty} A^{i-1} \mathbf{1}^T \dots \dots \dots (5)$$

\bar{A} 를 不合格狀態까지 포함된 完全한 형태의 轉移行列이라고 한다면 \bar{A} 는 다음과 같이 표시될 수 있다.

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline O & I \end{array} \right] \dots \dots \dots (6)$$

여기서 B 는 합격상태에서 불합격상태로 가게 될 확률로 구성되는 $m \times 1$ 벡터, O 는 $1 \times m$ 零 벡터이며, I 는 스칼라量으로 1이다.

A 에 속한 狀態들은 모두 一時狀態(transient states)로서, 여기서는 일단 이 상태를 벗어나면(즉 불합격상태로 되면) 다시는 이 상태로 돌아올 수가 없으며, I 에 속한 불합격 상태는, 일단 이 상태에 進入하면 다시는 벗어날 수가 없게 되는 吸收狀態(absorbing state)이다. ロット의 不合格事象이 발생하면 一聯의 事象이 여기서 終結되는 것이다.

轉移行列이 (6)과 같을 때, 이를 absorbing

$$8) \mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$$

7) Ewan과 Kemp는 品質이 一定한 水準으로 유지될 때 措施(action)를 취하기 전까지 檢査한 試料(sample)數의 期待値로, Page는 檢査를 통과한 製品(item)數의 期待値로 定義하였다.

chain이라 하며 이 때 A 에 대해서는 다음과 같은 關係式이 성립한다.

$$I + A + A^2 + \dots = (I - A)^{-1}$$

이를 이용하면 (5)식은 다음과 같이 표시된다.

$$ARL = 1 + \pi(I - A)^{-1} \mathbf{1} \dots \dots \dots (7)$$

여기서 π 와 A 는 검사방식의 母數 c_1, c_2 에 따라 각기 다른 형태를 갖게 되는 바, 三段階 샘플링 檢査方式에서의 π 와 A 를 構成하는 방법을 記述하면 다음과 같다.

(1) 合格狀態의 定義

k 번째 룯트의 검사를 행할 때, k 번째 룯트의 試料 中の 불량품수가 c_1 이하면 $k-1$ 번째 또는 $k+1$ 번째 룯트의 검사내용과는 무관하게 k 번째 룯트는 合格된다. 이러한 경우에는 0부터 c_1 까지의 整數값으로 狀態를 표시하고 이러한 狀態의 集合을 S_k 라고 定義한다. 이 때 S_k 의 元素의 수는 c_1+1 이 된다.

k 번째 룯트의 試料 中の 불량품수가 c_1 보다 크고 c_2 이하이면 $k-1$ 번째, $k+1$ 번째 룯트의 검사결과를 고려하여야 한다. $k-1$ 번째 검사결과를 이용하는 단계에서는 不合格判定은 가능하나 合格判定은 불가능하므로 $k+1$ 번째 룯트가 포함될 수 있도록 合格狀態가 정의되어야 한다. 그러므로 이 때는 $k-1, k, k+1$ 번째 룯트의 試料 中の 不良品數를 차례대로 표시하여 狀態를 나타낸다. 이러한 狀態의 集合을 S_c 라 定義한다. 合格狀態의 全體集合을 S 라 하면 $S = S_k \cup S_c$ 가 된다.

例] $c_1=1, c_2=3$ 인 경우

$S_k = \{0, 1\}$ 이며 $S_c = \{020, 021, 120, 030\}$ 이므로 $S = \{0, 1, 020, 021, 120, 030\}$ 이 된다.

(2) π 벡터의 構成

π 는 품질의 변화가 발생한 직후 첫번째 룯트가 합격될 확률로써 구성되는 바 j 번째 元素 π_j 는 (1)에서 定義된 合格狀態 集合의 j 번째 元素와 對應하게 된다. P_i^* , P_j 를 각각 품질의 변화 이전의 룯트 및 변화 이후의 룯트의 試料 中에서 i 개의 不良品이 나올 확률이라고 定義하고 P_i^* , P_j 로써 π_j 값을 나타내기로 한다.

例) $c_1=1, c_2=3$ 인 경우

合格狀態 集合 S 는

$$S = \{0, 1, 020, 021, 120, 030\}$$

이므로 이에 따른 π 는 다음과 같다.

$$\pi =$$

$$\{P_0, P_1, P_0^*P_2, P_0, P_0^*P_2, P_1, P_1^*P_2P_0, P_0^*P_2P_0\}$$

狀態 021은 當該 룯트의 검사결과가 2일 때, 直前 및 直後의 검사결과가 각각 0.1인 경우를 말한다. 그런데 여기서 直前의 룯트는 品質의 變化가 발생하기 전의 룯트이므로 021에 대응하는 π_4 값은 $P_0^*P_2P_1$ 이 되는 것이다.

(3) A 行列의 構成

狀態 i 에서 狀態 j 로의 轉移確率(transition probability) a_{ij} 는 다음의 두 경우로 나누어서 구한다.

(3.1) $i \in S_c$ 일 경우

임의의 $k(k \geq 1)$ 번째 段階⁹⁾에서, 狀態 i 의 第二位數, 第三位數는 각각 k 번째, $k+1$ 번째 룯트의 검사결과를 나타낸다. 즉 이 경우는 k 번째 룯트가 合格되기 위해서는 $k+1$ 번째 룯트의 검사결과가 狀態 i 의 第三位數처럼 나와야 하는 것을 의미한다. 따라서 $i \in S_c$ 인 경우에는, i 의 第二位, 第三位數가 j 의 第一位, 第二位數와 연 관되어야 하는 바 (j 의 時點이 i 의 時點보다 一段 階後이기 때문이다.) 이 때의 轉移確率は 다음과 같이 된다.

① $j \in S_c$ 일 때

j 의 第一位, 第二位數가 각각 i 의 第二位, 第三位數와 같으면 $a_{ij} = P_r$ 이 된다. 여기서 r 은 j 의 第三位數이다. 그 외의 경우에는 $a_{ij} = 0$ 이 된다.

② ①에서 $a_{ij} > 0$ 인 j 가 하나도 없으면 i 의 第三位數와 같은 값을 갖는 j 가 반드시 S_c 속에 있게 된다. 이 때는 $a_{ij} = 1$ 이 된다.

(3.2) $i \in S_k$ 일 경우

이 경우는 狀態 i 가 $k+1$ 번째 룯트의 검사결과와는 무관하므로 (3.1)의 경우처럼 복잡하지

9) k 번째 룯트의 檢査時點을 말한다.

는 않다.

① $j \in S_a$ 이면 $a_{ij} = P_j$ 가 된다.

② $j \in S_c$ 이면, j 의 第一位數가 i 와 같은 값 일 때는 $a_{ij} = P_r P_s$ 가 된다. 여기서 r, s 는 각각 j 의 第二位, 第三位數이다. j 의 第一位數가 i 와 다른 값일 때는 $a_{ij} = 0$ 이 된다.

$$A=020 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 020 & 021 & 120 & 030 \\ 0 & P_0 & P_1 & P_2 P_0 & P_2 P_1 & 0 & P_3 P_0 \\ 1 & P_0 & P_1 & 0 & 0 & P_2 P_0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 021 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 120 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 030 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例) $c_1=1, c_2=3$ 일 경우

(7)식을 이용한 각 검사방식의 ARL의 계산

表 3. ARL의 比較 ($p^0=0.0025$)¹⁰⁾

検査方式 不良率 p^1	三段階 샘플링 検査	ChSP- c_1, c_2	條件附 從屬 二回 샘플링 検査	條件附 保留 二回 샘플링 検査
	$n=40$ $c_1=0, c_2=1$	$n=50$ $(k_1, k_2; c_1, c_2)$ $= (1, 2; 0, 1)$	$n=50$ $(a_1, r_1; a_2, r_2)$ $= (0, 2; 1, 2)$	$n=50$ $(a_1, r_1; a_2, r_2)$ $= (0, 2; 1, 2)$
0.003	57.91	39.68	39.54	39.44
0.005	23.63	16.87	16.84	16.55
0.008	10.88	8.24	8.25	7.87
0.010	7.68	6.04	6.05	5.65
0.020	2.91	2.65	2.67	2.29
0.030	1.84	1.83	1.84	1.53
0.040	1.43	1.48	1.50	1.25
0.050	1.24	1.29	1.31	1.13
0.060	1.14	1.18	1.20	1.07

결과가 表 3이다. 여기서 三段階 샘플링 検査方式과의 비교대상은 모두 條件附 샘플링 検査方式들로서, 각 방식들은 유사한 OC 曲線을 갖는다. ChSP-0,1 방식과 DEP(0, 2; 1, 2) 방식간의 ARL은 거의 차이가 없으며, DEF(0, 2; 1, 2) 방식의 ARL은 위의 두 방식보다 약간씩 작은 값을 갖는다. 不良率이 낮을 때에는 三段階 検査方式이 他 検査方式에 비해 ARL 값이 높은 편이며 不良率이 높아짐에 따라서 값에 있어서 큰 차이를 보이고 있지 않다. 表 3의 경우 三段階 샘플링 検査方式의 試料의 크기가 他 방식에 비해 작은 값을 가지며, 실제로 품질이 低下되었을 때 感知의 遲延으로 야기되는 損失은 變化의 幅이 클 때이므로 試料 크기의 節減은 反應의 遲延에 의한 損失을 相殺할 수 있을 것이다.

三段階 샘플링 検査方式에서는 條件附保留 샘플링 検査方式에서와 같이 當該 ロット의 判定에 次後의 ロット의 検査結果를 利用하게 됨에 따라 次後의 ロット의 検査結果가 나올 때 까지 當該 ロット의 判定이 保留되는 경우가 있다. 判定의 保留事象은 保留된 ロット를 위한 空間의 確保등 適用上의 문제점이 될 수도 있다. 餘他の 保留 検査方式에서는 母數값에 따라 判定保留된 ロット의 queue의 길이가 결정되지만 三段階 検査方式이나 條件附 保留 二回 検査方式에서는 queue의 길이가 1보다 클 수는 없다. 따라서 이 경우는 判定保留確率은 queue의 길이의 期待値가 된다.

三段階 샘플링 検査方式에서 判定保留事象이 발생하는 것은, 當該 ロット의 검사결과로써 判定을 하지 못하고 直前의 ロット의 검사결과로써도 判定을 하지 못할 때이다. 즉 i 번째 ロット의 검사를 행할 때 i 번째 ロット의 試料중의 不良品數 d_i 가 $c_1 < d_i \leq c_2$ 이며, $i-1$ 번째 ロット의 試料중의 不良品數 d_{i-1} 과 d_i 의 合 $d_{i-1} + d_i$ 가 c_2 를 超過하지 않을 때 判定의 保留事象이 발생하게 되는 것이다. 따라서 判定保留確率 P_a 는 一般的

V. 判定保留確率

10) $p^0=0.0025$ 는 품질이 變化하기 이전의 工程品 質水準이며, 이 값에서 p^1 의 여러 값으로 變化하였을 때의 ARL이 표시되어 있다.

表 4. 不良率이 $p_{0.95}$ 일 때의 判定保留確率

c_1	c_2	$np_{0.95}$	P_d
0	1	.16	.116
0	2	.30	.239
1	3	.60	.098
0	3	.49	.371
1	4	.77	.163
0	4	.68	.481
1	5	.96	.237
1	6	1.16	.314
2	8	1.68	.230
3	10	2.27	.188
3	11	2.46	.229
4	13	3.07	.193
4	14	3.29	.232
3	15	3.41	.442
4	20	4.75	.514
6	30	7.45	.615

으로

$$P_d = \sum_{i=c_1+1}^{c_2} P_{n,i} \sum_{j=0}^{c_1-i} P_{n,j} \dots \dots \dots (8)$$

이 된다. 表 4는 不良率이 $p_{0.95}$ 일 때 여러 c_1 , c_2 값에 대한 P_d 값을 보여 준다. c_1 값에 비해 c_2 값이 상대적으로 클 때 P_d 값이 크다는 것을 表 4를 통해 알 수 있다. 當該 ロット의 檢査結果로써 判定을 하지 못할 때 다음 段階에서는 直前의 ロット의 檢査結果를 이용하게 되나 이 때는 不合格判定만이 가능하다. 그런데 c_1 값에 비해 c_2 값이 상대적으로 크면 直前의 ロット의 檢査結果를 이용하는 第二段階는 직접 判定에 기여하는 바는 적을 것이다. 第一段階, 第二段階에서의 不合格判定個數를 도입함으로써 이와 같은 문제점은 改善될 수 있을 것이며 따라서 判定保留確率을 감소시킬 수가 있을 것이다.

그림 2는 비슷한 OC 曲線을 갖는 條件附保留

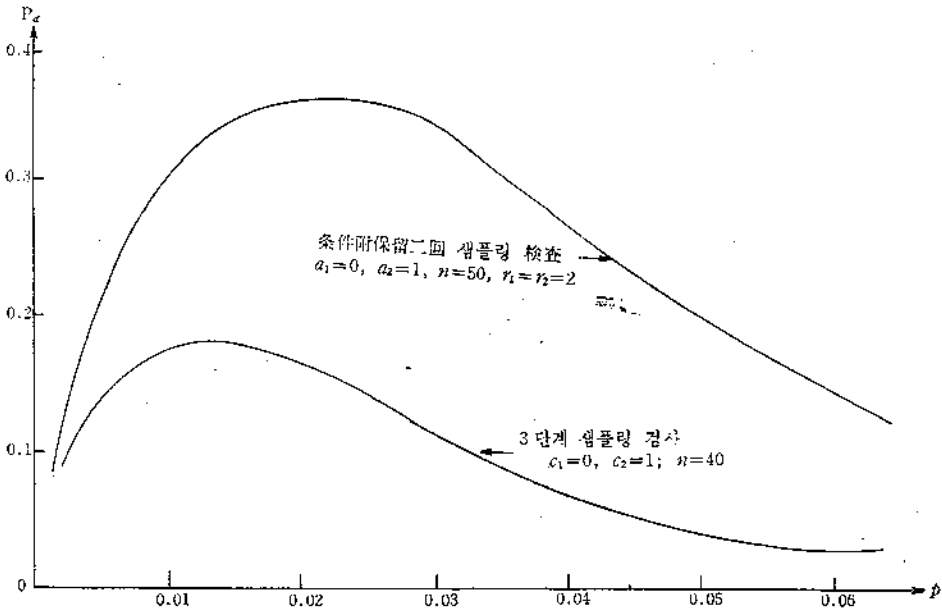


그림 2. 保留二回 및 三段階 샘플링 檢査方式의 判定保留確率

二回 샘플링 檢査方式과 三段階 샘플링 檢査方式의 判定保留確率을 보여 준다. 이를 보면 三段階 샘플링 檢査方式의 判定保留確率が 더 작음을 알 수 있다. 三段階 샘플링 檢査方式에서는 判定을 保留하기 전에 直前의 ロット의 檢査結果를 이용하는 段階가 있는 바 이러한 效果가 다소 반영되었을 것으로 思料된다.

VI. 結 論

工程의 品質이 비교적 일정한 수준을 유지하는 경우에는 當該 ロット의 判定에 他 ロット의 檢査結果를 이용함으로써 試料의 크기를 줄일 수가 있다. 이러한 概念下에서 一聯의 條件附 샘플링 檢査方式이 개발되어 왔다. 그렇지만 대부분의 既存 條件附 샘플링 檢査方式들은 몇가지 문제

점을 각기 안고 있어 實用性이 缺如되어 있다고 할 수 있다.

本 研究에서 提示한 三段階 샘플링 檢査方式은 既存의 $n_2=2n_1$ 인 二回 샘플링 檢査方式의 設計表를 직접 이용할 수 있는 方式으로서, 이는 理解하기가 쉽고 適用節次가 간단할 뿐 아니라 既存 二回 샘플링 檢査方式에 비해 試料의 크기를 크게 줄일 수 있는 방식이다.

工程品質의 변화에 대한 反應의 遲延 및 判定의 保留事象등이 三段階 샘플링 檢査方式의 문제점으로 指摘될 수 있으나 이러한 문제들은 실제로 심각한 정도는 아니며, 이 검사방식의 적용으로 얻게 되는 試料 크기의 節減은 위와 같은 문제점을 充分히 相殺할 수 있을 것이다.

參考文獻

- [1] Anscombe, E. J., Godwin, H. J., and Plackett, R. L., "Methods of Deferred Sentencing in Testing the Fraction Defective of a Continuous Output," *Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society*, Vol. 9, Nos. 1-2, 1947, 198-217.
- [2] Baker, R. C., and Brobst, R. W., "Conditional Double Sampling," *Journal of Quality Technology*, Vol. 10, No. 4, October 1978, 150-154.
- [3] Cameron, J. M., "Tables for Constructing and for Computing the Operating Characteristics of Single Sampling Plans," *Industrial Quality Control*, Vol. 9, No. 1, Part I, July 1952, 37-39.
- [4] Dodge, H. F., "Chain Sampling Inspection Plan," *Industrial Quality Control*, Vol. 11, No. 4, January 1955, 10-13.
- [5] Dodge, H. F., and Stephens, K. S., "Some New Chain Sampling Inspection Plans," *Industrial Quality Control*, Vol. 23, No. 2, August 1966, 61-67.
- [6] Duncan, A. J., *Quality Control and Industrial Statistics*, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Ill., 4th Edition, 1974.
- [7] Ewan, W. D., and Kemp, K. W., "Sampling Inspection of Continuous Process with No Auto-correlation between Successive Results," *Biometrika*, Vol. 47, Nos. 3-4, December 1960, 363-380.
- [8] Frishman, F., "An Extended Chain Sampling Inspection Plan," *Industrial Quality Control*, Vol. 17, No. 1, July 1960, 10-12.
- [9] Hamaker, H. C., and Van Strik, R., "The Efficiency of Double Sampling for Attributes," *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 50, No. 271, September 1955, 830-849.
- [10] Hill, I. D., Horsnell, G., and Warner, B. T., "Deferred Sentencing Schemes," *Applied Statistics*, Vol. 8, 1959, 76-91.
- [11] Page, E. S., "Continuous Inspection Schemes," *Biometrika*, Vol. 41, Nos. 1-2, June 1954, 100-115.
- [12] Soundararajan, V., "Procedures and Tables for Construction and Selection of Chain Sampling Plans (ChSP-1), Part II," *Journal of Quality Technology*, Vol. 10, No. 3, July 1978, 99-103.
- [13] Stephens, K.S., and Dodge, H.F., "Two-stage Chain Sampling Inspection Plans with Different Sample Sizes in the Two Stages," *Journal of Quality Technology*, Vol. 8, No. 4, October 1976, 209-224.
- [14] Wald, A., *Sequential Analysis*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1947.
- [15] Wortham, A.W., and Baker, R.C., "Deferred State Sampling Procedures," *Annals of Assurance Sciences 1971 Annual Symposium on Reliability*, 64-70.
- [16] Wortham, A.W., and Baker, R.C., "Multiple Deferred State Sampling Inspection," *International Journal of Production Research*, Vol. 14, No. 6, November 1976, 719-731.
- [17] Wortham, A.W., and Baker, R.C., and Mogg, J. M., "Dependent Stage Sampling Inspection," *International Journal of Production Research*, Vol. 8, No. 4, 1970, 385-395.

要 約

本 研究는 條件附 샘플링 檢査方式의 일종인 三段階 샘플링 檢査方式을 提示하고 있다. 第一段階에서는 當該롯트에서 얻어진 檢査結果에 의해서 判定을 하며, 第一段階에서 判定을 하지 못하면, 第二段階로서, 當該롯트 및 直前의 롯데의 檢査結果로써 判定을 하게 된다. 第二段階에서도 判定을 하지 못하면 直後의 롯데의 檢査結果가 나올 때까지 判定을 保留한다. 檢査方式의 母數를 구하는 데는 既存의 $n_2=2n_1$ 인 二回 샘플링 檢査計劃表를 利用할 수 있다.

本 研究에서 提示한 三段階 샘플링 檢査方式은 工程의 品質이 비교적 一定한 水準인 경우에 적용함으로써 試料의 크기를 크게 節減시킬 수 있는 방식이다. 工程品質의 變化에 대한 反應의 遲延 및 判定의 保留事象이 三段階 샘플링 檢査方式의 問題點으로 指摘될 수 있으나 이러한 문제들은 실제로 심각한 정도는 아니며 試料의 크기의 節減은 위와 같은 문제점들을 充分히 相殺할 수 있을 것이다.